[Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by an imbalance of thermal stress imposed during the cooling of solder in component mounting (Component mounting

Note: As this phenomenon is not progressive, this is not considered as a defect now.

10-1-4 複数引け巣/多点的收缩孔/ Multiple shrinkage cavities

【特徴】はんだフィレットの中に複数の巣が認めら れる欠陥

【特征】焊脚中有多个气孔的缺陷。

[Characteristics] Multiple small cavities exist in a solder fillet.

【起因・判断ポイント・発生工程】電子部品実装は んだが冷却する際の熱ストレスのアンバランスによ り出来たもの(電子部品実装工程)※ただしこの現 象は、進行性がないため現在のところ不良としては 扱われていない。

【原因、判断要点、发生工序】元件封装的焊料在冷 却时, 热应力不平衡而引起的(元件封装工序) ※这 种现象没有重复性, 现在不作为不良处理。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by an imbalance of thermal stress imposed during the cooling of solder in component mounting (Component mounting process)

Note: As this phenomenon is not progressive, this is not considered as a defect now.



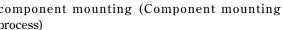
【コメント】 断面 顕微鏡倍率× 200 【注释】 截面 显微镜倍率 × 200 [Coments]

Microsection Magnification: ×200

【コメント】 断面 顕微鏡倍率× 【注释】

截面 显微镜倍率×

[Coments] Microsection Magnification: ×



10-1-5 リード線界面剥離/引脚的界面剥离 / Separation of solder from component lead

【特徴】部品リード線とはんだの界面が剥離してい る状態の欠陥

【特征】元件的引脚从焊接界面分离的缺陷。

[Characteristics] A solder fillet is separated from the component lead at the solder joint interface.

【起因・判断ポイント・発生工程】電子部品実装は んだが冷却する際の熱ストレスのアンバランスによ り出来たもの(電子部品実装工程)



【コメント】 断面 顕微鏡倍率× 200 【注释】 截面 显微镜倍率 × 200

[Coments] Microsection Magnification: ×200